

{joomplu:1587}{joomplu:1586}В период с 17 по 19 апреля 2019 года сотрудники АО «ЭНПО СПЭЛС» и ИЭПЭ НИЯУ МИФИ Л.Н. Кессаринский и Н.А. Усачев приняли участие с устными докладами в ежегодной научно-технической конференции «Пути решения задач обеспечения современной радиоэлектронной аппаратуры надежной электронной компонентной базой» («СЕРТИФИКАЦИЯ ЭКБ-2019»), которая проходила в г. Санкт-Петербург:

1) Л.Н. Кессаринский / **ПРИБОРОТЕКА - центр измерительных приборов для безрискового перевооружения сертификационных и производственных стендов контроля работоспособности ЭКБ;**

2) Н.А. Усачев, В.В. Елесин, А.Г. Кузнецов, В.А. Телец, А.Г. Филаретов, Н.А. Шелепин, Е.М. Савченко, А.Н. Щепанов // **Актуальные вопросы радиационно-ориентированной характеристики технологических процессов для контрактного производства импортозамещающей ЭКБ твердотельной СВЧ электроники.**

{joomplu:1584} В работе конференции приняли участие руководители предприятий и специалисты из более чем 50 ведущих предприятий. В ходе вступительных и пленарных заседаний было представлено 15 докладов и сообщений от руководителей ведущих предприятий (Л.А. Ершова (АО «РНИИ «Электронстандарт») В.Ю. Храброва (Комитет по промышленной политике и инновациям С.-Петербурга), А.А. Споркова (ДРЭП Минпроторга России), П.П. Куцько (ФГУП «МНИИРИП»), В.Б. Стешенко (АО «РКС»), Р.Г. Левин (АО «РНИИ «Электронстандарт»), А.Г. Филаретов (АО «Светлана-Рост»), И.В. Жулин (АО «Тестприбор»), В.С. Анашин (АО «ОРКК»-«НИИКП»), А.В. Коннов (АО «Промтехносерт»), Б.П. Беленький (АО «НИИ «Гириконд»), Д.А. Кондрашов (ООО «Остек-Электро»), К.В. Воронов (ЗАО «РЕОМ»)). Общее количество заявленных докладов составляло 40.

По завершении конференции сотрудникам АО «ЭНПО СПЭЛС» и ИЭПЭ НИЯУ МИФИ были вручены дипломы об участии.

Благодарим наших коллег и партнеров из АО «РНИИ «Электронстандарт» за организацию научно-технического мероприятия!